**申請機器に関する技術情報（GM用）**

(Technical Information on DUT)

一般社団法人ＫＥＣ関西電子工業振興センター 御中

**会社名 :**

**担当者名 :**

**電話番号 :**

**E-mail :**

※依頼試験申請書と名称が一致するようにご記入をお願いします。

**試験品名 :**

**型式番号 :**

**製造番号 :**

**商標名 :**

**テストプラン番号及び承認日 :**

**適応規格 :** General Motors EMC standard: GMW3097 February 2004

General Motors EMC standard: GMW3097 July 2006

**Category :** D　R　A　AS　AM　AX　BM　EM

|  |
| --- |
| ◆ 次頁よりご記入いただく技術情報の内容は、試験報告書に転記・記載いたしますので、保護をかけず、編集が可能な状態でご返信ください。  ◆ 試験実施内容から逸脱しないようにお願いします。  ◆ テストプランの内容から逸脱しないようにお願いします。  ◆ 試験報告書の書式が、**和文であれば日本語**で、**英文であれば英語**でご記入ください。  ◆ 記載いただきました全ての内容は申請者から提供された情報として試験報告書に明記いたします。 |

|  |
| --- |
| 個人情報のお取扱いについて  ご提供いただいた個人情報に関しましては、本サービスご提供のための業務（受付・連絡・請求書発行等）に利用させていただきます。また、当センターのサービス向上に向けて、各種のご案内・情報提供・情報収集やアンケート実施に利用させていただく場合がありますので、ご了承願います。ご不明な点がありましたら、試験事業部（0774-29-9139）までお問い合わせください。 |

# 変更履歴と確認履歴

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 変更  履歴 | 作成／修正 | 申請者記入欄 | | KEC記入欄 | |
| 日付 | 申請者 | 日付 | 作成者／承認者 |
| – | 新規 | 年     月     日 |  |  |  |
| R1 | 修正　確認 | 年     月     日 |  | 年     月     日 |  |
| R2 | 修正　確認 | 年     月     日 |  | 年     月     日 |  |
| R3 | 修正　確認 | 年     月     日 |  | 年     月     日 |  |
| R4 | 修正　確認 | 年     月     日 |  | 年     月     日 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 変更履歴 | |
| – | 新規作成 |
| R1 | 供試装置についての情報  (1)　(2)　(3)　(4)  試験についての情報  (1)　(2)　(3)　(4)　(5)　(6)　(7)　(8)  試験装置の情報  (1)　(2)　(3)　(4)  テストプランの補足及び、各試験項目での確認事項  (1)　(2)　(3)　(4)　(5)　(6)　(7)　(8)　(9)　(10)　(11)　(12)　(13)　(14)  □その他（　　　　　） |
| R2 |  |
| R3 |  |
| R4 |  |

# 供試装置についての情報

## (1) Overview （概要）

**試験報告書記載事項**

（供試装置の概要をご記入ください）

| Overview |
| --- |
|  |

## (2) Serial Number （製造番号）

**試験報告書記載事項**

（Applicable test: サンプルに対する試験項目（全ての試験で適応の場合はAll testsとご記入ください））

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Test Sample No. | Serial Number | Applicable Test |
| 1 |  |  |

## (3) Software Version （ソフトウェアバージョン）

**試験報告書記載事項**

|  |  |
| --- | --- |
| Item | Version No. |
|  |  |

## (4) Test Power Supply （試験電源電圧）

**試験報告書記載事項**

| Test Power Supply |
| --- |
| DC:      V  AC: 1φ　 3φ　     V, Frequency      Hz |

# 試験についての情報

## (1) Test Mode （試験モード）

**試験報告書記載事項**

（試験モードをご記入ください。複数試験モードがある場合は行を増やしご記入ください。）

（Applicable Testsは試験モードで適用される試験項目を記載してください。全項目であればAll testsとご記入ください）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mode No. | Test Mode | Applicable Tests |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

## (2) Test Condition （試験条件）

**試験報告書記載事項**

（上記試験モードに対して、詳細な条件をご記入ください。複数試験モードがある場合は行を増やし記載してください。）

|  |  |
| --- | --- |
| Mode No. | Test Condition |
| 1 |  |
| 2 |  |

## (3) Monitored item for Immunity Tests （イミュニティ試験における各動作モードのモニタ項目と方法）

**試験報告書記載事項**

（イミュニティ試験における各動作モードの動作チェック方法とモニタ方法をご記入ください。）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mode No. | Monitored Item | Monitored Method |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

## (4) Performance Status for Immunity Tests （イミュニティ試験における各判定基準に対する供試装置の記述）

**試験報告書記載事項**

（イミュニティ試験時のDUTの性能基準（許容範囲等）をご記入ください。）

性能判定の判断が難しい場合は、試験への立会いをお願いします。

| Performance  Status | Conformity Item of DUT |
| --- | --- |
| I |  |
| II |  |
| III |  |
| IV |  |

## (5) Modification of Standard （規格からの変更点）

## 試験報告書記載事項

（規格からの変更点があれば記入ください。）

|  |
| --- |
| Modification of Standard |
|  |

## (6) Modification of Test plan （テストプランからの変更点）

## 試験報告書記載事項

（テストプランからの変更点があれば記入ください。）

|  |
| --- |
| Modification of Test plan |
|  |

## (7) イミュニティ試験の適合性判断

**試験報告書記載事項**

|  |
| --- |
| 詳細情報 |
| テストプランに従う  規格に規定された内容に従う  適用外 |

## (8) エミッションの限度値判定について

**試験報告書記載事項**

|  |
| --- |
| 詳細情報 |
| 規格要求値未満  規格要求値＋社内マージン 放射エミッション（     dB）／伝導エミッション（     dB）  規格要求値＋KECの測定不確かさ  適用外 |

# 試験装置の情報

## (1) Diagram of Test System （試験構成図）

**試験報告書記載事項**

（各試験時のブロック図を作成してください。試験項目によって図が異なる場合は複数作成してください。）



## (2) List of Test System （試験システムのリスト）

**試験報告書記載事項**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Device Name | Model No. | Trade Name | Applicable Tests |
| A1 |  |  |  |  |
| A2 |  |  |  |  |
| A3 |  |  |  |  |

## (3) List of Connector in DUT （コネクタリスト）

**試験報告書記載事項**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Connector Name | Terminal Name | Function | Notes |
| C1 |  |  |  |  |
| C2 |  |  |  |  |

## (4) List of Wiring Harness （ハーネスのリスト）

**試験報告書記載事項**

* Length : テストプランで指定されているハーネスの長さ
* Applicable Tests : 下記のハーネスを使用する試験項目
* Notes : 補足事項（試験ハーネスがツイストケーブルであればtwistと記載してください）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Harness Name | Shielded  (Y/N) | Length  (m) | Applicable Tests | Notes |
| H1 |  |  |  |  |  |
| H2 |  |  |  |  |  |
| H3 |  |  |  |  |  |

# テストプランの補足及び、各試験項目での確認事項

※日本語でご記入ください。

※テストプランの内容から逸脱しないようにお願いします。

## (1) 供試装置の接置方法

* 供試装置を接置する際に、以下の方法がある。

例1）50mmの絶縁物上に設置する。

例2）グランドプレーン上に直接設置する。

例3）50mmの絶縁物上に設置し、アースストラップを使用しグランドプレーンに接地する。

|  |  |
| --- | --- |
| テスト項目 | 設置方法 |
|  |  |
|  |  |

## (2) イミュニティ試験

（試験有 試験無）

（試験がある場合は、各周波数での照射時間をご記入ください。）

（3.4.4 Magnetic Field試験については最低照射時間は30 秒になっています。）

|  |  |
| --- | --- |
| テスト項目 | 停留時間(sec) |
| 3.4.1 BCI |  |
| 3.4.2 Anechoic Chamber |  |
| 3.4.4 Magnetic Field |  |

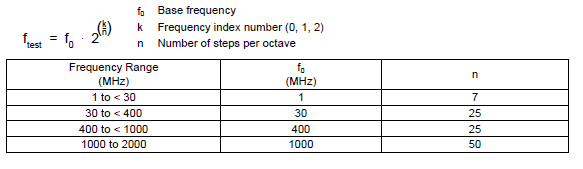
## (3) イミュニティ試験

（試験有 試験無）

（試験がある場合は、規格外の要求があればご記入ください。）

（規格通りであれば“規格通り”のチェックボックスにチェックを入れてください。規格内の条件は下表を参照ください。）

（規格通り 規格外）



## (4) 3.3.1 ALSE（放射エミッション），3.4.2 Anechoic Chamber（放射イミュニティ）

（試験有 試験無）

（試験がある場合は、X軸、Y軸、Z軸（合計3軸）で試験を実施するかどうかご記入ください。）

（写真や図などで試験軸を説明してください。）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| テスト項目 | 試験軸 | テスト軸 |
| ALSE  （放射エミッション） | X軸 |  |
| Y軸 |  |
| Z軸 |  |
| Anechoic Chamber  （放射イミュニティ） | X軸 |  |
| Y軸 |  |
| Z軸 |  |

## (5) 3.3.2 CE 試験

（試験有 試験無）

（試験がある場合は、測定ハーネス名をご記入ください。）

（複数電源ラインがある場合は、試験を個別で行なうか、同時に行なうかをご記入ください。）

|  |  |
| --- | --- |
| 電源 | 試験対象ライン名 |
| +LINE |  |
| - LINE |  |

## (6) 3.5.1 CE Transient 試験

（試験有 試験無）

（試験がある場合は、測定ライン名をご記入ください。）

（複数電源ラインがある場合は、試験を個別で行なうか、同時に行なうかをご記入ください。）

（試験に使用する指定スイッチは用意されますか？（ 用意する  用意しない））

※用意しない場合は当センターのスイッチを使用します。（指定のスイッチとは異なります）

|  |
| --- |
| 試験対象ライン名 |
|  |

## (7) 3.4.1 BCI 試験

（試験有 試験無）

（試験がある場合は、規格外の要求があればご記入ください。）

（規格通りであれば“規格通り”のチェックボックスにチェックを入れてください。規格内の条件は下表を参照ください。）

（規格通り 規格外）

|  |
| --- |
| 規格外の要求 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 規格内の条件 | | |
| 周波数範囲  (MHz) | プローブポジション  (mm) | インジェクション方法 |
| 1-30 | 150 | DBCI |
| 1-30 | 450 | DBCI |
| 30-400 | CBCI |
| 30-400 | 750 | CBCI |

## (8) 3.4.4 Magnetic Field 試験

（試験有 試験無）

（試験がある場合は、印加軸、試験面をご記入ください。）

（試験面の写真か図で記入お願いします。）

（貴社で試験面の決定をお願いします。）

|  |  |
| --- | --- |
| テスト項目 | テスト面 |
| Magnetic Field |  |

参考図



## (9) 3.5.2 CI Transient on Power Lines 試験

（試験有 試験無）

（試験がある場合は、試験対象ライン名をご記入ください。）

（複数電源ラインがある場合は、試験を個別で行なうか、同時に行なうかをご記入ください。）

|  |
| --- |
| 試験対象ライン名 |
|  |

## (10) 3.5.2 CI Coupling to I/O Other Than Power Supply Lines 試験

（試験有 試験無）

（試験がある場合は、試験対象ライン名をご記入ください。）

|  |
| --- |
| 試験対象ライン名 |
|  |

## (11) 3.5.3 CI Direct Capacitor Coupling to sensor lines 試験

（試験有 試験無）

（試験がある場合は、試験対象ライン名をご記入ください。）

|  |
| --- |
| 試験対象ライン名 |
|  |

## (12) 3.5.4 CI85V Direct Capacitor Coupling 試験

（試験有 試験無）

（試験がある場合は、試験対象ライン名をご記入ください。）

|  |
| --- |
| 試験対象ライン名 |
|  |

## (13) ESD 試験

（試験有 試験無）

（試験がある場合は、テストプランに記載されている印加ポイントをご記入ください。）

（写真や図などで印加場所を説明してください。）

## (14) 3.6.4 ESD Remote I/O 試験

（試験有 試験無）

（試験がある場合は、テストプランに記載されている試験対象ライン名をご記入ください。）

|  |
| --- |
| 試験対象ライン名 |
|  |